

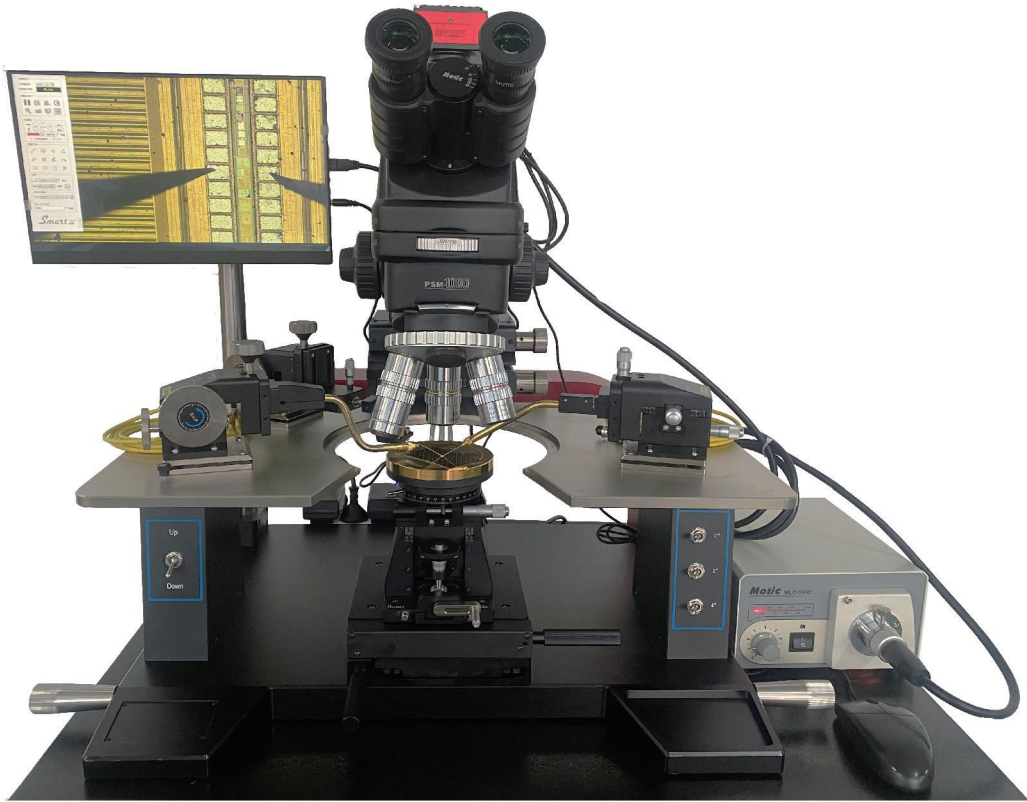
标准探针台/DN系列增强型探针台

产品概要

DN系列探针台是我司一款增强型晶圆测试探针台，最大可完成12英寸晶圆的电学测试。此系列探针台采用高刚性显微镜龙门结构，显微镜可X-Y-Z方向进行精密位移调节。卡盘具备上下调节功能，可以使探针与样品快速分离，提高测试效率，在科研单位和半导体工厂都得到了广泛运用，配合对应的仪器仪表，可以完成集成电路/芯片/MEMS器件/PCB元器件/材料器件的IV/CV特性测试/管芯晶圆/LED/LCD/太阳能电池行业的测试。此系列探针台可以实现1μm以上的Pad电极测试。

技术特点

- 显微镜具备高刚性龙门支架且搭配气动升降，保证高质量的光学成像；
- 卡盘同时具备快速和微调升降，便于样品和探针快速分离，也可以加载探针卡；
- 可升级性强，可升级卡盘360度快速移动，可升级光电流扫描成像或拉曼-瞬态荧光寿命成像系统等。



详细参数

技术参数		产品型号	DN4	DN6	DN8	DN12
探针台台体	主体材料		航空铝	航空铝	航空铝	航空铝
	整机尺寸（mm）		580L*480W*620H	630L*530W*620H	700L*580W*620H	800L*650W*620H
	重量		50kg	60kg	80kg	120kg
	自适应减震系统		自适应减震底座设计，可有效过滤环境中的震动源干扰			
	卡盘大小		4",360度转动,可微调	6",360度转动,可微调	8",360度转动,可微调	12",360度转动,可微调
	卡盘XY轴行程		4"*4",精度10um	6"*6",精度10um	8"*8",精度10um	12"*12,精度10um
	卡盘Z轴行程		快速升降5mm，微调升降行程6mm，精度1微米			
	卡盘材质		不锈钢镀金，具备更小的接触电阻			
	卡盘吸附方式		真空吸附，可选择环形吸附或者多孔吸附（适用于薄片）			
	背电极测试功能		卡盘镀金，电学独立悬空，带2个4mm香蕉头插口，具备背电极功能			
	其它功能		带标准接地保护，可升级，Chuck360度快速移动（选件）			
针座平台	材质		U型平台，Q235镀镍，带接地端子			
	大小		最多可放置4~6个探针座		最多可放置8~10个探针座	
显示系统	显微镜类型		体式显微镜/视频显微镜/金相显微镜+CCD 成像系统			
	倍率范围		16X~200X/40X~280X/20X~4000X			
	显微镜行程		具备高刚性龙门架结构,XYZ 行程分别为2 英寸*2 英寸*2 英寸，精度 1um			
	CCD 成像系统		2k或者4K相机，帧率 60fps，带拍照/录像/测量功能等功能			
探针座	种类		丝杆型/微分头型/经济型探针座			
	X-Y-Z 行程		12.5mm-12.5mm-12.5mm			
	机械精度		0.5um/0.7um/2um			
夹具	漏电精度		同轴夹具10pA/三轴夹具100fA			
	接口形式		同轴/三轴/SMA/香蕉头/鳄鱼夹/裸线等接口			
其它	选件		Chuck360度快速移动/屏蔽箱/防震桌/射频/同轴/三轴加热卡盘/探针卡/光电流显微镜/大功率			
	电力需求		220V/50HZ			